

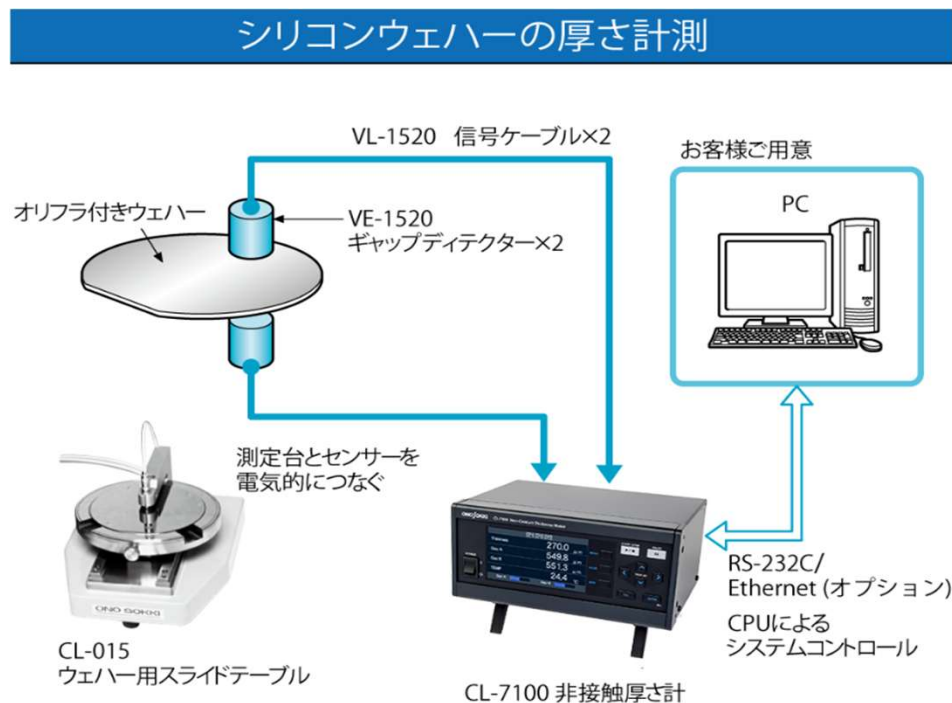
シリコンウェハや半導体用ガラスマスクの厚み計測

ONO SOKKI

○静電容量式非接触厚さ計 CL-7100シリーズ

概算価格：¥ 700,000.~

導体・半導体・絶縁体の厚さを非接触で高精度に測定する静電容量式非接触厚さ計です。
 ウェハや電磁鋼板、各種フィルムなどの厚み計測に対応します。
 RS-232Cを標準装備し、オプションでアナログ出力、BCD出力、Ethernet通信など多彩な出力に対応。
 付属のリモート端子や通信機能を用いることで、外部機器からのコントロールや遠隔監視が可能です。



センサタイプ	測定範囲 (μm)	表示分解能 (μm)	
		標準	CL-0200 高分解能演算機能 オプション装着時
VE-2011	20 ~ 200	0.1	0.02
VE-5010	50 ~ 500	0.1	0.05/0.02
VE-5011	20 ~ 200		
VE-1020	100 ~ 1000	0.1	0.1
VE-1021			
VE-1520	150 ~ 1500	0.5	0.2
VE-3020	300 ~ 3000	1	0.5
VE-8020	800 ~ 8000	2	1
VE-8021			